北京邮电大学 物理实验报告

班号 2021211314 姓名 李永琰 学号 2021211353 实验日期 2022.03.22

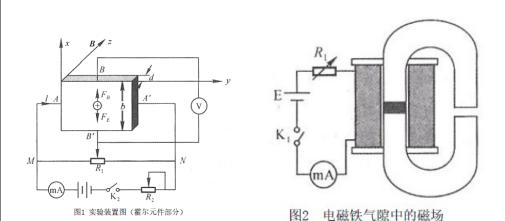
实验目的:

通过用霍尔元件测量磁场,判断霍尔元件载流子类型,计算载流子的浓度和迁移速度,以及了解霍尔效应测试中的各种负效应及消除方法。

实验原理与操作步骤[基本物理思想、实验设计原理、物理公式及其意义、电路图(光路图)等;主要操作步骤]

实验原理:

1. 通过霍尔效应测量磁场



霍尔效应装置如图1和图二所示。将一个半导体薄片放在垂直于它的磁场中(B的方向沿z轴方向),当沿y方向的电极A、A′上施加电流I时,薄片内定向移动的载流子(设平均速率为u)受到洛伦兹力 F_R 的作用。

$$F_B = q u B$$

无论载流子是负电荷还是正电荷, F_B 的方向均沿着x方向,在洛伦兹力的作用下,载流子发生偏移,产生电荷积累,从而在薄片B、B'两侧产生一个电位差 $V_{BB'}$,形成一个电场E。电厂使载流子又受到一个与 F_B 方向相反的电场力 F_E ,

$$F_E = q E = q V_{BB'}/b$$

其中b为薄片宽度, F_E 随着电荷积累而增大,当达到稳定状态时 $F_E=F_B$,即

$$q u B = q V_{BB'}/b$$

这时在B、B'两侧建立的电场成为霍尔电场,相应大电压成为霍尔电压,电极B、B'成为霍尔电极。另一方面,设载流子浓度为n,薄片厚度为d,则电流强度I与u的关系为:

I = bdnqu

有上述各式得到

$$V_{BB'} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d} = R_H \frac{IB}{d}$$

 R_H 为霍尔系数,它体现了材料的霍尔效应大小。根据霍尔效应制作的元件成为霍尔元件。

$$K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nqd}$$

Kn为霍尔元件灵敏度

由此,若I、 K_H 已知,只要测出霍尔电压 $V_{BB'}$,即可算出磁场B的大小;并且若知载流子类型(N型半导体载流子多为电子,P型半导体多数载流子为空穴),则由 $V_{BB'}$ 的正负可测出磁场方向,反之,若已知磁场方向,则可判断载流子类型。

由于霍尔效应建立所需时间很短 $(10^{-12}\sim10^{-14}s)$,因此霍尔元件使用交流电或者直流电都可。使用交流电时,得到的霍尔电压也是交变的,(7)中的I和 $V_{BB'}$ 应理解为有效值。

2. 霍尔效应实验中的负效应

在实际应用中,伴随霍尔效应经常存在其他效应。例如实际中载流子迁移速率u服从统计分此外,在使用霍尔元件时还存在不等

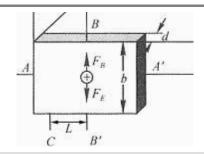
布规律,速度小的载流子受到的洛伦兹力小于霍尔电场作用力,向霍尔电场作用力方向偏转,速度大的载流子受到磁场作用力大于霍尔电场作用力,向洛伦兹力方向偏转。这样使得一侧高速载流子较多,相当于温度较高,而另一侧低速载流子较多,相当于温度较低。这种横向温差就是温差电动势V₈,这种现象称为爱廷豪森效应。这种效应建立需要一定时间,如果采用直流电测量时会给霍尔电压测量带来误差,如果采用交流电,则由于交流变化快使得爱廷豪森效应来不及建立,可以减小测量误差。

此外,在使用霍尔元件时还存在不等位电动势引起的误差,这是因为霍尔电极B、B'不可能绝对对称焊在霍尔片两侧产生的。由于目前生产工艺水平较高,不等位电动势很小,故一般可以忽略,也可以用一个电位器加以平衡(图-1中电位器 R_1)。我们可以通过改变 I_5 和磁场B的方向消除大多数副效应。具体说在规定电流和磁场正反方向后,分别测量下列四组不同方向的 I_5 和图组合的 $V_{RB'}$,即

+B, +I	V _{BB} ′=V ₁	
-B, +I	V _{BB′} =-V ₂	
-B, -I	V _{BB′} =V ₃	
+B, -I	V _{BB} '=-V ₄	

然后利用 $V_{BB'}=rac{|V_1|+|V_4|+|V_3|+|V_4|}{4}$ 得到霍尔电压平均值,这样虽然不能消除所有的负

效应,但其引入的误差不大,可以忽略不计。电导率测量方法如下图所示。设B'C间距离为L,样品横截面积为S=bd,流经样品电流为 I_s ,在零磁场下,测得B'C间电压为 $V_{B'C}$,根据欧姆定律可以求出材料的电导率。电导率公式 $\sigma=(I_sL)/(V_{B'C}S)$ 。



操作步骤:

- 0.将测试仪上*Im*输出,*Is*输出和*VH*输入三对接线柱分别与实验台上对应接线柱连接。打开测试 仪电源开关,预热数分钟后开始实验。
- 1.保持 I_m 不变,取 I_m =0.450A, I_s 取 0.50,1.00······,4.50mA,测绘 V_{H} - I_s 曲线,计算 R_H 。
- 2.保持*Is*不变,取*Is*=4.50mA, *Im*取 0.050,0.100······,0.450A, 测绘*VH-Im*曲线。
- <u>3.在零磁场下,取*Is*=0.1mA</u>,,测*VB' C*。
- 4.确定样品导电类型,并求载流子浓度 n ,迁移率 μ ,电导率 σ (1/ Ω cm)。

以上为预习内容

实验仪器名称:

QS-H 霍尔效应组合仪(包括电磁铁,霍尔样品和样品架,换向开关和接线柱)、小磁针、测试仪

实验数据记录

一、在零磁场下测量 V_{α} 的值:

在零磁场下,当 I_s =0.1mA 时,霍尔元件上 DE 之间的电势差 V_σ (单位:mV)_____;记录霍尔片参数: L(DE之间距离)= 2.976mm ,宽 b= 3.968mm_,厚度 d=_0.4996mm_。

二、测量霍尔元件的 V_H —Is 特性曲线: 移动霍尔元件片使其处于磁场最大处。保持电路中的励磁电流 Im=0.45A 不变,调节工作电流 Is 从 0.5 mA 增加到 4.5mA,每隔 0.5mA 测量相应的霍尔电压值 V_H (单位: mV)。

此时励磁电流大小 Im= 0.45 (A),励磁线圈的系数: $\mu_m \cdot n = 5100$ (Gs/A),计算电磁线圈的磁场大小为 $B=\mu_m \cdot n \cdot Im= 0.2295$ (T)。注: $1T=10^4$ Gs

Is/mA	$V(+I_{m}, +I_{s})$	$V(-I_{m}, +I_{s})$	$V(+Im, -I_s)$	$V(-Im, -I_s)$	V_H
I_s =0.5mA	<u>-1.50</u>	<u>1. 49</u>	<u>1.48</u>	<u>-1.47</u>	<u>1. 485</u>
$I_s=1.0 mA$	<u>-2. 99</u>	<u>2. 98</u>	<u>2. 97</u>	<u>-2. 96</u>	<u>2. 975</u>
I_s =1.5mA	<u>-4. 48</u>	<u>4. 47</u>	<u>4. 46</u>	<u>-4. 45</u>	<u>4. 465</u>
I_s =2.0mA	<u>-5. 97</u>	<u>5. 96</u>	<u>5. 95</u>	<u>-5. 94</u>	<u>5. 955</u>

$I_s=2.5$ mA	<u>-7. 46</u>	<u>7. 45</u>	<u>7. 44</u>	<u>-7. 46</u>	<u>7. 445</u>
I_s =3.0mA	<u>-8. 94</u>	<u>8. 94</u>	<u>8. 93</u>	<u>-8. 92</u>	<u>8. 932</u>
I_s =3.5mA	<u>-10. 44</u>	<u>10. 43</u>	<u>10. 42</u>	<u>-10. 41</u>	<u>10. 42</u>
I_s =4.0mA	<u>-11. 92</u>	<u>11. 91</u>	<u>11. 91</u>	<u>-11. 90</u>	<u>11. 91</u>
I_s =4.5mA	<u>-13. 41</u>	<u>13. 40</u>	<u>13. 40</u>	<u>-13. 39</u>	<u>13. 40</u>

实验过程截图贴至此处(包括实验装置连线图,实验时间,电流表、电压表对应上表中任意

1次的测量值)



三、测量霍尔元件的 V_H — Im 曲线:移动霍尔片使其处于磁场最大处。保持电路中的工作电流 Is=4.5mA 不变,调节励磁电流 Im 从 0.05 A 增加到 0.45A,每隔 0.05A 测量相应的霍尔电压值(单位: mV)。

此时工作电流大小 Is= 4.5 (mA)。

	$V(+I_{m}, +I_{s})$	$V(-Im, +I_s)$	$V(+Im, -I_s)$	$V(-Im, -I_s)$	V_H
Im =0.05A	<u>-1.37</u>	<u>1. 36</u>	<u>1. 37</u>	<u>-1.36</u>	1.365
Im =0.10A	<u>-2.88</u>	<u>2.87</u>	<u>2. 88</u>	<u>-2.87</u>	<u>2.875</u>
Im =0.15A	<u>-4. 38</u>	<u>4. 37</u>	<u>4. 38</u>	<u>-4. 37</u>	4. 375
Im =0.20A	<u>-5. 89</u>	<u>5. 88</u>	<u>5. 88</u>	<u>-5.87</u>	<u>5.880</u>
Im =0.25A	<u>-7. 39</u>	<u>7. 38</u>	<u>7. 38</u>	<u>-7. 37</u>	<u>7. 380</u>
Im =0.30A	<u>-8. 90</u>	<u>8.89</u>	<u>8.89</u>	<u>-8.88</u>	<u>8.890</u>
Im =0.35A	<u>-10. 40</u>	<u>10. 39</u>	<u>10. 39</u>	<u>-10.38</u>	<u>10. 39</u>
Im =0.40A	<u>-11. 91</u>	<u>11. 90</u>	<u>11. 89</u>	<u>-11.88</u>	<u>11.89</u>
Im =0.45A	<u>-13. 41</u>	<u>13. 40</u>	<u>13. 40</u>	<u>-13. 39</u>	<u>13. 40</u>

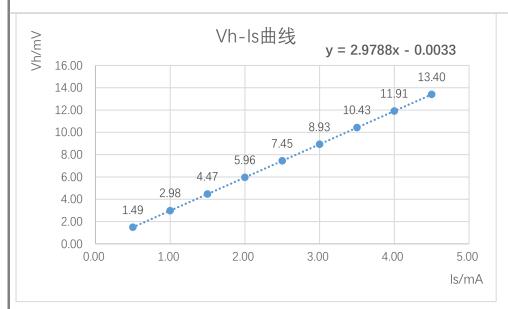
四、判断霍尔元件的载流子类型(请填P或N) N 型(选做,自行设计实验步骤)

五、数据处理要求:

1. 计算材料的电导率
$$\sigma = \frac{I_S \times L}{V_\sigma \times b \times d}$$
;

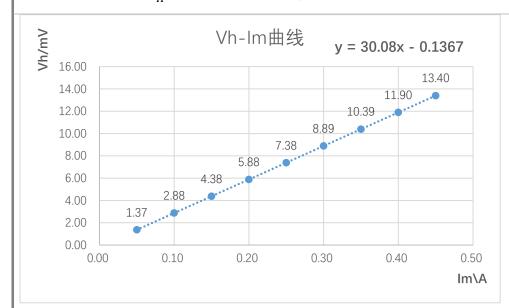
$$\sigma = \frac{I_s \times L}{V_\sigma \times b \times d} = \frac{0.1 \times 0.002976}{15.07 \times 0.003968 \times 0.0004996} = 9.9615(1/\Omega * m)$$

2. 绘制霍尔元件的 V_H — I_S 曲线,图解法求出斜率,计算霍尔元件灵敏度 $K_H = \frac{V_H}{I_S \times B}$;



$$K_H = \frac{V_H}{I_s \times B} = k \times \frac{1}{B} = 2.9788 \times \frac{1}{0.2295} = 12.98(V/(A \times T))$$

3. 绘制霍尔元件的 V_H —Im 曲线,并讨论;



由上述两图可知, V_H 与 I_S 成正比关系, V_H 与 I_m 成正比关系,且 I_m 和 B 成正比,因此我们能够推出 $V_H=k*IB$ (其中 k 为比例系数)

4. 计算霍尔元件的载流子浓度
$$\mathbf{n} = \frac{1}{K_H dq}$$
。(选做)

$$n = \frac{1}{K_H dq} = \frac{1}{12.98 \times 0.0004996 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 0.9735(\times 10^{21}/m^3)$$

回答问题:

1. 为什么霍尔元件要选用半导体材料制作? 为什么霍尔元件通常做成薄片状?

霍尔效应是磁敏效应。霍尔系数的大小也决定霍尔效应的明显程度。已知霍尔灵敏度 K_H =

 $\frac{1}{nqd}$,若载流子密度 n 较大时,霍尔灵敏度 K_H 比较小,则发生霍尔效应不明显。由于金属材料的载流子密度较大,而半导体的载流子密度比金属要小得多,为了让霍尔效应更明显所以选择半导体材料制作霍尔元件。同样根据上述公式,当霍尔元件的厚度 d 越小,则霍尔灵敏度 K_H 越大,霍尔效应越明显。故霍尔元件通常做成薄片状。

- 2. 如何判断实验中所用的霍尔元件是 N 型还是 P 型半导体材料?
- (1) 当 I_S 和 I_m 都为正值时,霍尔电压为正则为 P 型,反之为 N 型;
- (2)N型半导体材料的载流子迁移率比P型半导体材料高的多。